

## LD 集成式老化系统

### PSS LDBI13003



## 产品简介

### PRODUCT INTRODUCTION

LD 集成式老化系统，用于各种类型封装 LD 器件的老化筛选以及可靠性寿命分析。该系统可以通过软件配置管脚定义并提供高达 500mA 的驱动电流以及 150°C 高温老化条件，同时对器件的驱动电流、背光电流以及阈值进行实时监控测试，并自动进行产品失效判断。实时储存监控数据，支持对老化失效器件的数据追述。最多支持 3072pcs 的单次老化。

## 产品应用

### PRODUCT APPLICATION

- 批量生产环节中 LD T0 器件进行老化筛选
- 长时间可靠性失效测试分析

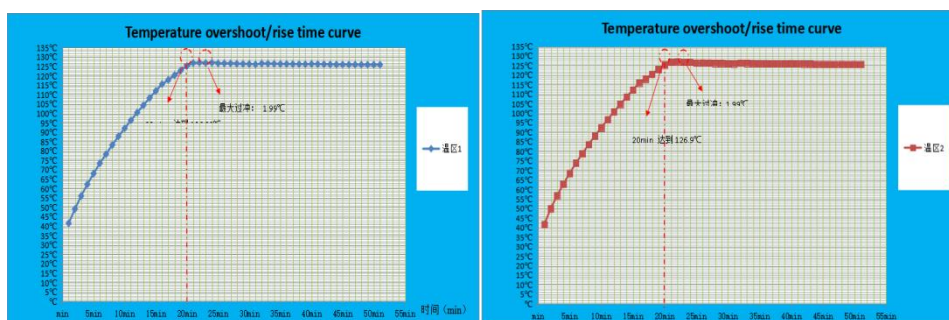
## 产品特点

### PRODUCT FEATURES

- 提供每路完全独立的驱动电流
- 软件切换支持各种类型封装 LD 器件的老化



- 两个独立老化箱体，可以完全独立控制，升温速度效率高，无过冲



- 支持多种算法计算  $I_{th}$
- 支持热插拔，可靠的 ESD/EOS 防护，保证器件老化期间的安全



- 支持老化板监控插拔次数在线记录功能
- 64 路老化板作为通用载体，可以实现盘测、老化、分拣不同工位直接的转料，提高生产效率

## 技术参数

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

参数	指标
测试路数	单板 64 路，左右 2 个仓，每层 24 个，共 3072 路
独立温区数	2 个
LD 驱动电流	0~250mA
LD 正向电压	0~3V
LD 监控电流	0~250mA
PD 监控电流	0~2000uA
管脚定义	软件切换支持各种封装类型的器件
I <sub>th</sub> 扫描	支持 I <sub>m</sub> 扫描计算 I <sub>th</sub>
温度范围	RT+20°C~150°C
温度精度	±2°C
温度均匀性	满载时≤3°C，空载时≤2°C
升温过冲	≤3°C
长期温度稳定性	0.5°C
升温速度	100°C/半小时
设备尺寸（宽 x 高 x 深）	1400 x 1800 x 1200 (mm)
电源规格	三相五线 AC 380V/50HZ